

Lecture Program

www.parts2clean.de

Rund um Reinigungsprozesse *All around cleaning processes*

- 10:45 **Neue Erkenntnisse zur MAFAC Vektorkinematik und Anwendungsbeispiel aus der Praxis**
New insights into the MAFAC vector kinematics and case study
Thomas Gutmann, MAFAC - E. Schwarz GmbH & Co. KG
-
- 11:10 **Reinigung mit Laserstrahlung – Für jede Anwendung die passende Technologie**
Cleaning with laser radiation – The right technology for every application
Sabrina Vogt, TRUMPF Laser- und Systemtechnik GmbH
-
- 11:35 **Reinigungsanforderungen in der Elektronik**
Facing the Requirements of Cleaning in Electronics Production
Thomas Otto, factronix GmbH
-
- 12:00 **Anforderungsgerecht trocknen – Was ist trocken?**
Drying according to requirements – What is dry?
Frank-Holm Rögner, Fraunhofer FEP
-
- 12:25 **Effiziente Prozessauslegung und -optimierung durch direkte Messung des Reinigungsergebnisses**
Efficient process design and optimization through direct measurement of the cleaning result
Stefan Büttner, SITA Messtechnik GmbH

Produktpräsentationen *product presentations*

- 12:50 **WIR LEBEN LÖSUNGEN**
Höckh Metall-Reinigungsanlage GmbH
-
- 12:52 **YMS YILMAZ METAL**
YILMAZ Metal Solutions
-
- 12:53 **BANDELIN Ultraschallreinigung**
BANDELIN electronic GmbH & Co. KG
-
- 12:55 **Laserstrahl-Reinigen und Entschichten in der Elektromobilität**
Clean-Lasersysteme GmbH
-
- 12:58 **SurTec Science Slam zu Industrial parts cleaning**
SurTec Deutschland GmbH
-
- 13:01 **Wässrige Reinigung mit deconex**
Max F. Keller GmbH
-
- 13:04 **Vorstellung bzw. Produktpräsentation der neuen Pero Reinigungsanlage S1 mit innovativem Bedienkonzept**
PERO AG
-
- 13:07 **Perfekter Schall von 25 kHz bis 1 MHz**
Weber Ultrasonics AG
-
- 13:08 **Der neue VARIO – hochflexibel und individuell konfigurierbar**
EVT Eiberger Verfahrenstechnik GmbH

Digitalisierung / Automatisierung *Digitization / Automation*

- 13:15 **Vernetzung mit OPC UA in der Reinigungstechnik**
OPC UA Communication in cleaning Technology
Thomas Danner, MOC Danner GmbH
-
- 13:40 **KI-basierte Bildverarbeitung in der Reinigungstechnik**
AI-based image processing in cleaning technology
Clemens Briese, Fraunhofer IPK
-
- 14:05 **Predictive maintenance am Beispiel von Pinselwaschtischen**
Predictive maintenance by the example of manual parts washers
Renate Thörner, Bio-Circle Surface Technology GmbH
-
- 14:30 **QSREIN4.0: Stabile und sichere Reinigungsprozesse durch Digitalisierung von Prozessparametern mit qualitätssichernder Prozessführung**
QSREIN4.0: Stable and safe cleaning processes through digitization of process parameters with quality-assuring process control
Guido Sturm
SturmConsultants | ST-SturmTEC Systeme GmbH
-
- 14:55 **Demonstrator zur Digitalisierung von Bauteilreinigungsanlagen**
Practical Digitalization Solution for Intelligent Component Cleaning
Enrico Fuchs, Fraunhofer IVV

www.parts2clean.de

Produktpräsentationen *product presentations*

- 15:20 **Baldwin PureFiltration – Mikro- und Ultrafiltrationen für Prozessbäder**
Baldwin Technology GmbH
-
- 15:22 **UCMSmartLine – The Modular Solution for Precision Cleaning**
UCM AG
-
- 15:24 **Contamination control system for the clean production of technical parts and products. The next Generation of Technical Cleanliness Inspection.**
Olympus Deutschland GmbH
-
- 15:26 **Qualifizierung von Reinigungsprozessen**
factronix GmbH
-
- 15:29 **SITA SurfaSpector – Benetzung von Oberflächen schnell und einfach prüfen**
SITA Messtechnik GmbH
-
- 15:30 **Normpartikel und deren Anwendungsspektrum**
BIDAG Technologies GmbH & Co. KG
-
- 15:32 **Detecting bright particles – I can see what you can not see! “Bright residual dirt“**
dhs Dietermann & Heuser Solution GmbH
-
- 15:35 **Akkreditierter Analysenservice für Sauberkeitsprüfungen & Vertrieb instrumenteller Analytik (MicroQuick Partikel-scanner, Coxem SEM-EDX, Bruker Skyscan Micro-CT)**
RJL Micro & Analytic GmbH
-
- 15:38 **NOYEN clear solutions for a better tomorrow**
NOYEN Sp. z o.o.

Analytik / Technische Sauberkeit *Analytics / Technical cleanliness*

- 15:45 **Nachhaltigkeit ist eng mit technischer Sauberkeit und Partikelanalyse verknüpft**
Sustainability closely connected with cleanliness and particle analysis
Markus Fabich, Olympus Deutschland GmbH
-
- 16:10 **High-end Analytik: Kombination mehrerer Messmethoden zur Analyse von Oberflächen**
Combination of high-end methods for surface and interface analysis
Jakob Barz, Fraunhofer IGB
-
- 16:35 **Chemische Identifikation von Partikel: Normgerecht, leicht und schnell mit der LIBS-Methode**
Chemical identification of particles: Standard-compliant, easy and fast due to the LIBS-method
Konstantin Kartaschew, Leica Microsystems GmbH
-
- 17:00 **Filmische Verunreinigungen in der Linie detektieren: Schnell, ortsaufgelöst und empfindlich**
Detection of filmic contamination: Fast, spatially resolved and sensitive
Albrecht Brandenburg, Fraunhofer IPM

17:30 Uhr Ende End



Contacts

Frank-Holm Rögner
Fraunhofer
Reinigung
Tel. +49 351 2586-242
Frank-Holm.Roegner@
fep.fraunhofer.de

Christoph Nowak
Senior Project Director
Deutsche Messe
Tel. +49 511 89-31322
christoph.nowak@messe.de

Oliver Kruse
Project Director
Deutsche Messe
Tel. +49 511 89-33764
oliver.kruse@messe.de



Deutsche Messe
Messegelände
30521 Hannover
Germany

Tel. +49 511 89-0
Fax +49 511 89-32626
info@messe.de
www.messe.de

Specialist Cooperation Partner

